



Más allá de lo visible

Innovación en metrología de superficies

Día
13 de noviembre de 2024

Hora
De 9:30h a 15:00h
(15:00h Visita opcional)

Lugar
Instalaciones de Tekniker
EIBAR | [Ubicación](#)

AGENDA

09:15	Registro
09:30	Bienvenida y presentación Luis Uriarte Director General (TEKNIKER)
09:40	Tecnologías de vanguardia para metrología óptica David Páez Senior Product Specialist (SENSOFAR) Jesús Paredes Investigador en micro-nano metrología (TEKNIKER)
10:30	Explorando los retos de la metrología óptica de superficies: experiencias y aprendizajes Jesús Paredes Investigador en micro-nano metrología (TEKNIKER)
11:00	Textura superficial: de la teoría a la práctica David Páez Senior Product Specialist (SENSOFAR)
11:30	Café + Showroom
CASOS DE USO EN INDUSTRIA	
12:00	S-mart 2: Integration example into high precisión laser machine Gonzalo Guadaño Chief Officer (LASING)
12:20	Ponencia pendiente de confirmación
12:40	Ponencia pendiente de confirmación
13:00	Técnicas de caracterización para análisis y control de calidad a escala micro y submicrométrica para aplicaciones de recubrimientos PVD Ibon Azkona Director I+D (METAL ESTALKI)
13:20	Visita instalaciones de Tekniker
14:15	Lunch + Showroom
15:00	Fin jornada